



Technikfolgenabschätzung als politische Aufgabe

Herausgegeben
von

Prof. Dr. Raban Graf von Westphalen

in Gemeinschaft mit

Prof. Dr. Dr. Günter Altner · Dr. Waldemar Baron
Dr. Norbert Binder · Dr. Stephan Bröchler · Dr. Weert Canzler
Prof. Dr. Peter C. Dienel · Prof. Dr. Meinolf Dierkes
Dipl.-Wirt.-Ing. Alexander Fink · Prof. Dr. Jürgen Gausemeier
Prof. Dr. Carl Friedrich Gethmann · Prof. Dr. Arnim von Gleich
Myriam Grütter · Dipl. Pol. Dieter König
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Lenk · Dr. Rolf Meyer
Prof. Dr. Dres. h.c. Hans Mohr · Prof. Dr. Wilfried Müller
Prof. Dr. Dietrich Murswiek · Dr. Michael Norton
Mag. Dr. Walter Peissl · Prof. Dr. Friedrich Rapp
Prof. Dr. Günter Ropohl · Prof. Dr. Alexander Roßnagel
Prof. Dr. Peter Saladin · Dipl.-Wirt.-Ing. Oliver Schlake
Prof. Dr. Georg Simonis · Dr. Gerlinde Sommer
Dr. Otto Ullrich · Christine Wennrich M. A.
Dr. Johannes Weyer

3., gänzlich revidierte, neu bearbeitete und erweiterte Auflage

R. Oldenbourg Verlag München Wien

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme

Technikfolgenabschätzung als politische Aufgabe / hrsg. von Raban Graf von Westphalen in Gemeinschaft mit Günter Altner... - 3.,
gänzlich rev., neu bearb. und erw. Aufl. - München ; Wien :
Oldenbourg, 1997
ISBN 3-486-23715-2

© 1997 R. Oldenbourg Verlag
Rosenheimer Straße 145, D-81671 München
Telefon: (089) 45051-0, Internet: <http://www.oldenbourg.de>

Das Werk einschließlich aller Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.

Gedruckt auf säure- und chlorfreiem Papier
Gesamtherstellung: Grafik + Druck, München

ISBN 3-486-23715-2